



大阪大学産業科学研究所
総合解析センター



Comprehensive Analysis Center

The Institute of Scientific and Industrial Research

Osaka University

概 要

総合解析センター (Comprehensive Analysis Center) は、1977年に産研の附属施設として設置された材料解析センターを前身としますが、基礎から応用に至る産研の幅広い研究領域に対する支援をより総合的に行う共通施設として発展すべく、研究所本体の改組に合わせ、旧電子顕微鏡室を統合し、2009年度に発足しました。准教授1名、助教2名の専任教員をはじめ、技術職員4名、非常勤職員3名、兼任教員1名にセンター長を加えた人員構成を取っています。幸い、総合解析センターとしてリニューアルして間もなく、2010年度に獲得した補正予算により、老朽化した機器の多くを世界最先端の機器に更新することが叶い、本冊子に示すように、産研の多様な研究領域をカバーしうる組成分析、状態分析、分光分析機器が整備されました。これらの機器類は、センター専任の教職員によって、ユーザーが常時利用できるよう維持・管理されています。専門的な知識を必要とする機器類については、必要に応じてセンターの職員が解析をサポートすると同時に、容易に操作できる機器類は個々の研究者に終日開放しています。機器の使用法に関する利用者講習会も、新入生のための機器分析講習会をはじめ、毎年精力的に開催していますので、是非、本冊子に目を通して頂き、センター保有の分析機器類を存分に活用して頂ければ幸いです。

総合解析センターは、産研の附属共通施設であり、もちろん第一義には産研の研究支援施設と位置づけられます。一方で、大阪大学科学教育機器リノベーションセンター、分子研を中心とする大学連携研究設備ネットワークとの連携も深めています。連携することで、機器の更新やリノベーションセンターのスタッフの方々の業務支援を受けることが可能になり、実際、ICP、電顕の依頼測定への対応もできるようになりました。学内、学外の研究者、インキュベーション棟入居企業の方々による利用も増えてきています。2012年度に実施された産研の外部評価においては、「開かれたセンターとして日本のモデルケースとなり得るものであり、大阪大学が誇るべきものである」との高い評価も頂きました。今後も、産研の研究支援と学内外へのサービスとのバランスに留意しつつ、センター運営に尽力して行きたいと思えます。

センターの専任教員は、センター保有機器を駆使して、有機化学、物理有機化学、分析化学に関する独自の研究を行っています。その他、センターとして、「いちょう祭」等の一般公開や高校生への見学会にも積極的に参画し、先端機器や研究の紹介活動も行っています。

皆様にセンターの研究支援機能を最大限に活用して頂き、優れた研究成果を挙げて頂けるよう、教職員一同一層の努力をして参ります。皆様には、当センターの維持・発展に引き続きご理解・ご協力を頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

スタッフ

センター長(兼任)
准教授
助教
助教
助教(兼任)
技術補佐員
室長
技術職員
技術職員
技術職員
技術補佐員
派遣職員
特任技術職員
事務補佐員

加藤 修雄
鈴木 健之
周 大揚
朝野 芳織
西野美都子
石橋 武
田中 高紀
松崎 剛
羽子岡仁志
村上 洋輔
嵩原 綱吉
藤崎 充
横井 絵美
谷 悦子

医学品化学研究分野
総合解析センター
総合解析センター
総合解析センター
総合解析センター
技術室
技術室
技術室
技術室
技術室
総合解析センター
科学教育機器リノベーションセンター
科学教育機器リノベーションセンター
総合解析センター



加藤修雄



鈴木健之



周大揚



朝野芳織



西野美都子



石橋 武



田中高紀



松崎 剛



羽子岡仁志



村上洋輔



嵩原綱吉



藤崎 充



横井絵美



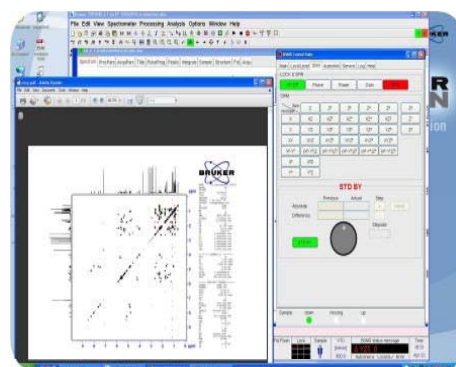
谷 悦子

装置一覧

装置名	機種 (メーカー)	設置室番	担当者
超伝導核磁気共鳴装置	Avance III 700 (BRUKER)	105	周
	Avance III 600 WB (BRUKER)	104	
	ECA600 (JEOL)	106	羽子岡
	ECS-400 (JEOL)	F428 ^{*1)}	
	ECS-400 (JEOL)	F507 ^{*1)}	
質量分析装置	JMS-700 (JEOL)	303	朝野
	JMS-600H (JEOL)	303	
	AccuTOF-DART (JEOL)	303	
	Ultraflex III (BRUKER)	304	松崎
	micrOTOF II (BRUKER)	304	
	Orbitrap XL (THERMO)	304	
	ITQ1100 (THERMO)	304	
フーリエ変換赤外分光光度計	FT/IR4100 (JASCO)	302	鈴木
	React-IR45m (METTLER)		羽子岡
紫外可視近赤外分光光度計	V-570 (JASCO)	302	羽子岡
旋光計	P-2300 (JASCO)	302	
高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置	ICPS-8100 (SIMADZU)	301	藤崎,羽子岡
X線マイクロアナライザー	JXA-8800R (JEOL)	102	田中,横井
二次イオン質量分析装置	SIMS4100 (ATOMIKA)	102	田中,嵩原
走査型電子顕微鏡	S-2150 (HITACHI)	102	田中,横井
	JSM-6330F (JEOL)	S107 ^{*2)}	石橋,横井
透過型電子顕微鏡	JEM-3000F (JEOL)	I103 ^{*3)}	石橋,村上
	JEM-2100 (JEOL)	S192 ^{*1)}	西野
全自動水平型多目的X線回折装置	SmartLab (RIGAKU)	203	田中,嵩原
単結晶自動X線回折装置	AFC-7RCCD,AFC-7R4CXD (RIGAKU)	203	田中,嵩原
	FR-E-IP,FR-E-AXIS IV (RIGAKU)		
CHN 微量元素分析装置	2400 (PERKIN-ELMER)	302	松崎
	JM10 (J-SCIENCE)		
示差熱天秤	TG8120 (RIGAKU)	302	田中,嵩原
示差走査熱量計	DSC8270 (RIGAKU)	302	田中,嵩原
ナノスケールハイブリット顕微鏡	VN-8010 (Kryence)	S107 ^{*2)}	石橋,横井

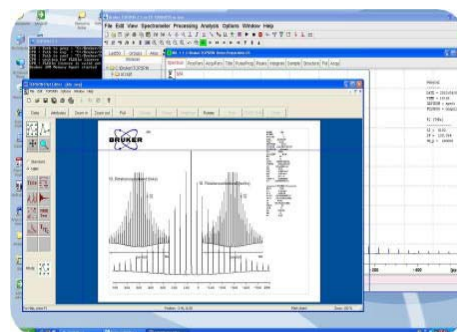
*¹⁾ 第1研究棟に設置されています。 *²⁾ 第2研究棟に設置されています。 *³⁾ インキュベーション棟に設置されています。

超高感度核磁気共鳴装置 700MHzNMR



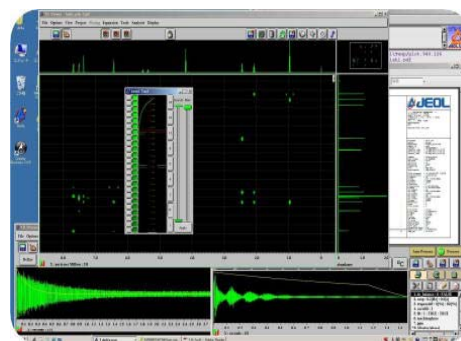
ブルカー・バイオスピンの最新型AVANCE III 700は最高レベルの最先端デジタルNMR装置です。クライオプローブとの組み合わせで、超高感度のNMR測定を実現します。 ^1H 、 ^{13}C 、 ^{15}N の超高感度三重共鳴プローブは ^1H 核と ^{13}C 核を観測するために最適化されており、2D, 3D測定も高感度、迅速に測定が可能です。測定時間が大幅に短縮されます。また、自動チューニング・マッチング機能もあり、サンプルチェンジャーと合わせて高速、高分解能の全自動測定ができ、薬学、生命工学、化学、材料科学などの分野に使用出来ます。

高速回転固体核磁気共鳴装置 600MHzNMR (solid)



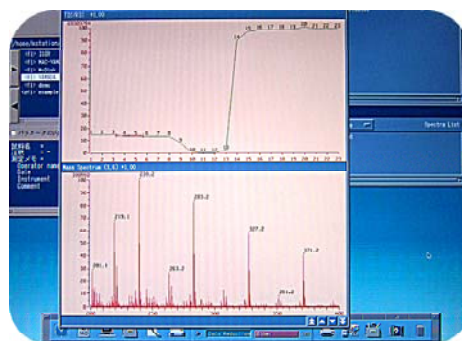
ブルカー・バイオスピンの最先端固体NMRのAVANCE III 600WBはワイドボアの磁石をもつ、 $-140\sim+150^\circ\text{C}$ の範囲内での測定が可能です。さらに4mmCPMASプローブ、超高速回転型の1.3mmCPMASプローブと組み合わせて、プロトン、多核、二次元まで従来測定が困難なものも、測定が可能です。これらによって、材料化学、固体触媒の解析から生命科学まで幅広い分野にご使用頂ける最高水準の固体NMR装置です。

高感度多核核磁気共鳴装置 600MHzNMR



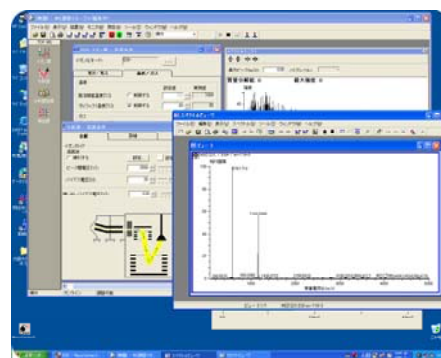
日本電子のJNM-ECA600は最新のデジタル技術と高周波数を駆使して開発されたFT-NMR装置です。JNM-ECA600MHzNMRはオートチューニング、マッチングを取り入れて、Gradient Shimを有する装置です。再現性良い高品位なNMRスペクトルが容易に得られます。また、軽水の消去測定や差スペクトルなどの測定も簡単にできます。さらに低周波数のプローブを有します。ロジウム核までの測定も可能です。MICCS装置も装着しているので、反応追跡測定も利用出来ます。

FAB質量分析装置 FAB-MS



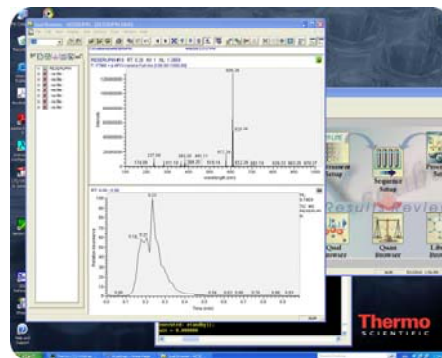
虚像形立体二重収束イオン光学系を持った質量分析装置です。セットアップからイオン源のチューニング、分解能の調整、データ測定、データ処理までを容易にオペレーションすることが可能です。難揮発性試料の高分解能質量測定するFABイオン化法専用装置として使用されています。

DART質量分析装置 DART-MS



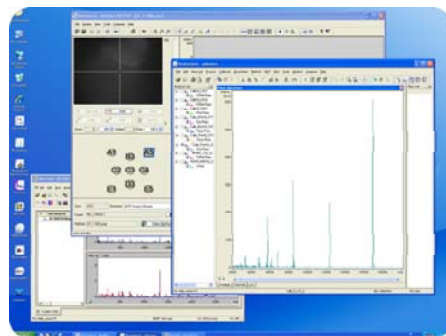
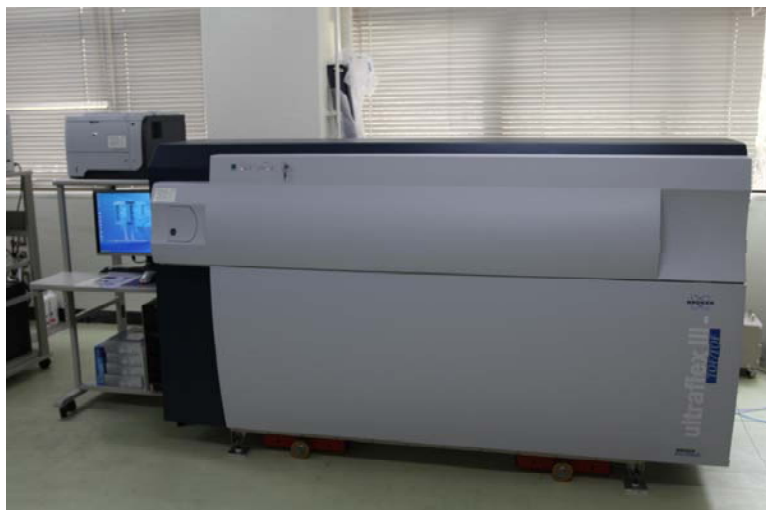
JEOL社製の高分解能飛行時間型質量分析装置に専用のDARTイオン源 (Direct Analysis in Real Time) を装着した質量分析装置です。DARTは、試料を大気圧下、接地電位のもとで非接触で迅速に分析可能な新しいイオン源です。AccuTOFとDARTを組み合わせることで精密質量測定に基づく正確な元素組成推定が可能です。気体、液体、固体のすべてに対して応用可能です。特に物質表面にある化学物質に対して、拭き取りや溶媒抽出などの前処理無しで分析することが可能で瞬時に測定を行うことができ、スクリーニングやハイスループット分析に有効です。

イオントラップ型質量分析装置 FT-MS



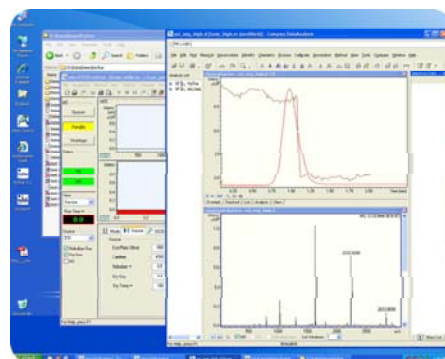
リニアイオントラップを搭載している高速・高感度のLTQ XLとOrbitrap を組み合わせた、ハイブリッド電場型フーリエ変換型質量分析計 (FT-MS) です。高分解能 (分解能100,000)、精度 (3ppm) の高い性能を示し、低分子構造解析はもとより、多段階MS/MSによる複雑なタンパク質の同定が可能です。スキャンスピードの高速化、サイクルタイムの短時間化により、1サンプルあたりの測定時間が数分～5分と非常に短く、イオン化法についてもESI法・APCI法・APPI法が選択でき最高水準で幅広い試料測定が可能です。

MALDI-TOF型質量分析装置 MALDI-MS



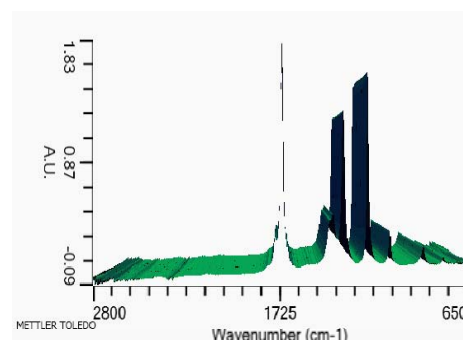
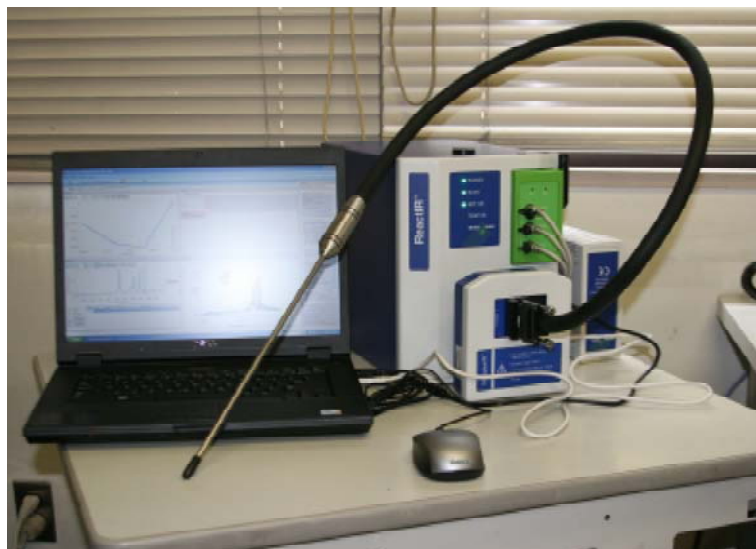
BRUKER社製のultraflex IIIはレーザーとして、smartbeamを用いることにより、感度と分解能が大幅に向上しています。このレーザーは焦点サイズを $10\mu\text{m}$ ~ $80\mu\text{m}$ の範囲に絞ってコンピューター制御できます。極小のレーザー焦点を試料に当てると、MALDIイメージング実験装置で非常に高いピクセル解像度で組織サンプル領域をスキャンでき、非常に高い感度と分解能が実現されます。広範な質量範囲と高分解能を実現するために開発されたPAN (panoramic) テクノロジーにより、1-500,000の質量範囲と25,000の分解能を示します。

クライオスプレーイオン化質量分析装置 CSI-MS



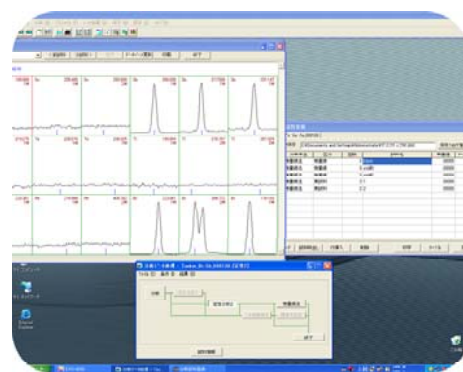
BRUKER社製のmicroTOF II (質量精度:1-2ppm, 質量分解能:16,500, 測定可能質量範囲:50-20,000 m/z) に極低温イオン源 (CryoSpray) を取り付けることにより、CryoSpray-ESI-TOF-MS測定を行えます。冷却されたイオン化条件下での測定が可能となりました。室温において構造が不安定な化合物、有機金属錯体、超分子複合体や反応中間体などの測定に最適です。

反応解析赤外分光光度計 React IR



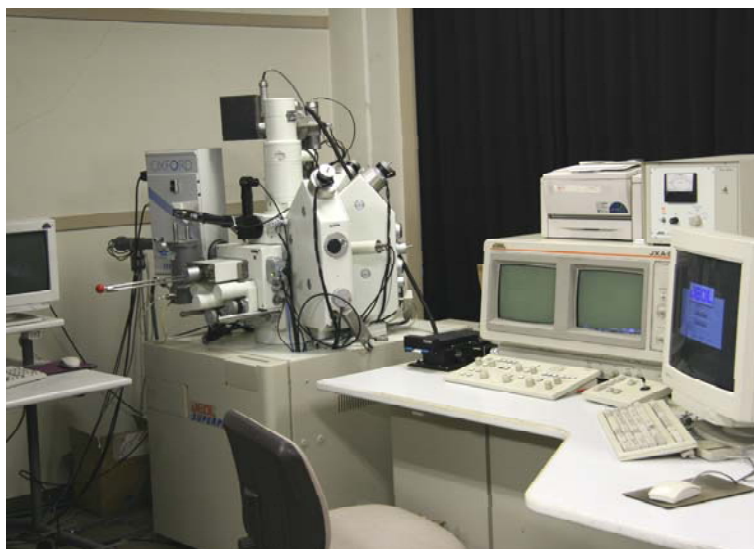
最短5秒ごとの連続測定を行うことにより、溶液の中で起こるさまざまな変化を赤外スペクトルとして連続的にモニターすることができます。化学反応中にのみ存在する反応中間体の同定や原料の消失速度、生成物の生成速度をピーク強度の変化から観察することができるため、化学反応機構の解析に役立ちます。

高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置 ICP



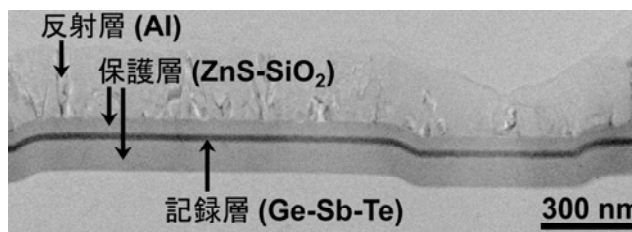
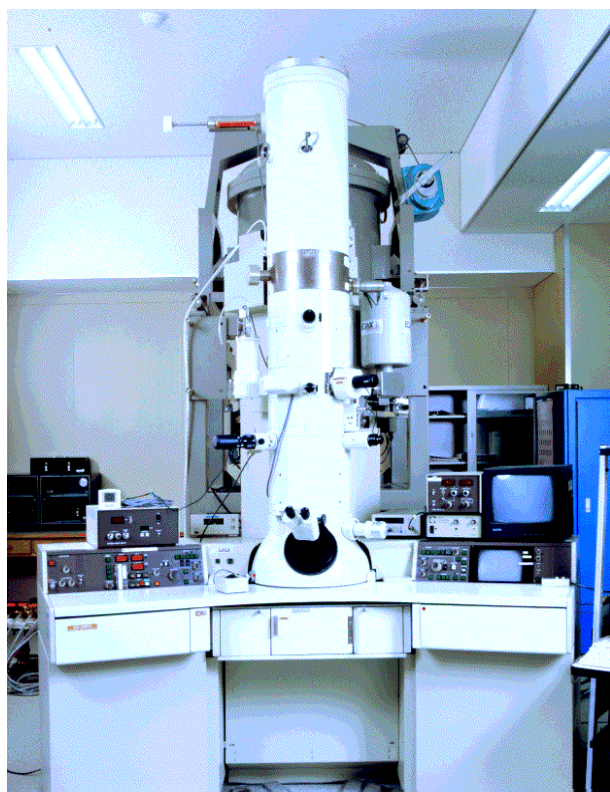
シーケンシャル分光器を2台搭載し高分解能・高速を両立した最高級ICP発光分光分析装置です。試料にプラズマのエネルギーを与え含まれている成分元素を励起します。その励起された原子が低いエネルギー準位に戻るとき放出される発光線を測定する装置です。溶液中にppbレベルで含まれる極微量元素から組成分析のような高濃度分析まで、高い精度で幅広い分析が可能です。又、多元素を迅速に同時定量分析することができます。

X線マイクロアナライザー EPMA



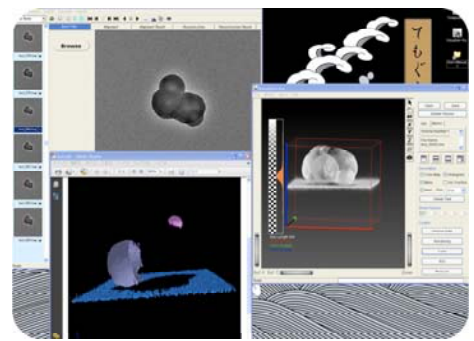
EPMA (Electron Probe Micro-Analyser) はLaB₆電子銃により発生した電子線を数十nmに細く絞り最大40kVまで加速し固体試料表面に照射します。発生する特性X線の波長により試料を構成している元素を同定し定量分析まで行えます。元素分布状態を知ることの出来るマッピング測定、線分析も可能となっております。測定元素範囲はB～Uまでで8分光結晶、4検出器が装備されています。本装置の特徴の一つとしてカソード・ルミネッセンスも測定が行えます。金属・鉱物・セラミックスをはじめ半導体材料の評価に威力を発揮します。

透過型電子顕微鏡 TEM



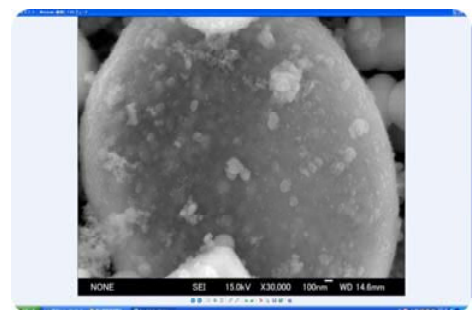
電界放射型300kV透過型電子顕微鏡 (TEM, EM-3000F) は各種試料の高倍率観察や極微少部の電子回折像の撮影、ナノメートルサイズの部位の元素分析に使用されます。最高分解能は0.17nm、搭載EDSによる組成分析はホウ素以上で可能です。

生物系透過型電子顕微鏡 3D-TEM



LaB₆電子銃搭載型200kV透過型電子顕微鏡 (JEM-2100) は、高分解能観察とハイコントラストを両立しており、生物系試料の観察に適しています。TEM像はCCDカメラでデジタルデータとして撮り込めます。高傾斜ホルダを用いて試料を最大±80°傾斜させることができ、TEMトモグラフィシステムにより自動で連続傾斜像を取得することができます。PCにより試料の3D再構成、3D構造の可視化が行えます。

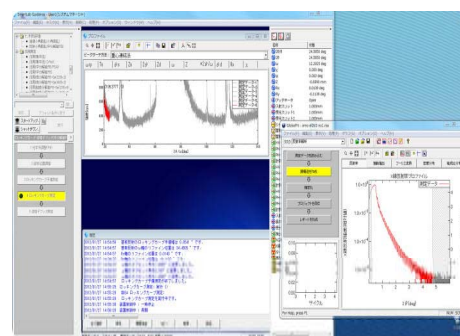
分析走査電子顕微鏡 FE-SEM+EDS



分析走査電子顕微鏡JSM-6335Fの分解能は～1nm(15kV)で加速電圧を1～30kVの範囲で使用できます。またSEMに装備している元素分析装置は特性X線の検出器をペルチェ素子で冷却するため液体窒素が不要です。この装置の検出元素はBe～Uまで、エネルギー分解能は138 eV以下です。カーボンコーターとオスmiumコーターも備えているため目的に応じて使い分けるとより鮮明な画像を得ることも出来ます。尚、使用には分析SEM(Wフィラメント電子銃)の講習を受け、使用免許を取得する必要があります。

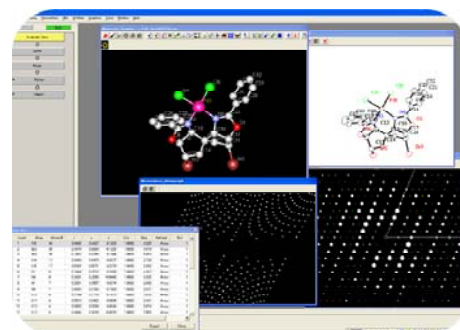


全自動水平型多目的X線回折装置 XRD



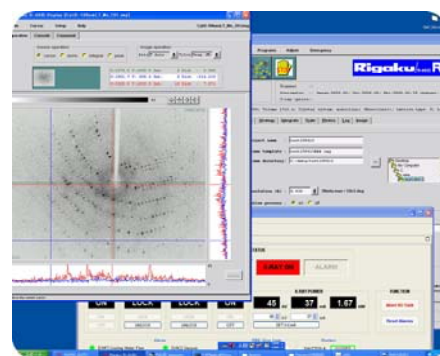
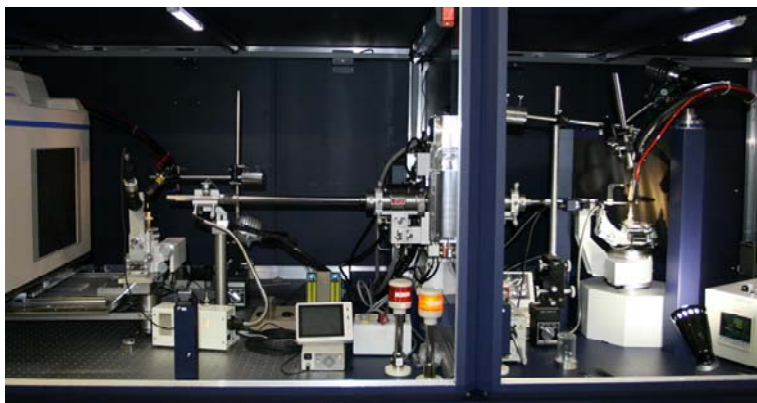
45kV、200mA (Cu) の強力X線を固体材料に照射し、試料から生じた散乱、回折X線を測定します。特に薄膜試料に驚異的な威力を発揮します。インプレーン測定をはじめ膜厚測定、配向測定、粒径孔径分布測定、ロッキングカーブ測定など多目的測定装置です。測定はガイダンス機能により初心者にも容易にデータを得ることが出来ます。X線入射源にはGe二結晶、四結晶が選択でき高分解能測定が可能です。また、シンチレーション検出器と数分で高速測定が行える一次元検出器が用意されています。さらに、ICDD (Ver 2.1102) も搭載されています。

単結晶X線回折装置 4CXD, CCD



有機化合物や無機化合物の単結晶に単一波長の強力X線 (60kV, 300mA, Mo) を照射し、各格子配列面から生じる回折X線の強度を高精度かつ自動的に収集する装置です。回折データ位置を高精度測定が行える四軸方式、高速測定が行えるイメージング・プレート方式の二種類のゴニオが設置されています。各ゴニオには試料高低温制御装置とが備えられており分子の揺らぎを最小限にしたデータが得られます。データから三次元的な分子構造や結晶分子パッキング構造が精密に決定されています。

高輝度型単結晶X線回折装置 IP



本装置のX線源にはCuが用いられており、有機低分子の絶対構造の解明が行えます。また、格子定数の大きな結晶にも適しております。さらに、高輝度ミラーを装着していますので回転単陰極型X線発生装置(18kW)と比較して10倍以上の輝度の高いX線源が確保され微量結晶のデータ収集が行えます。湾曲IP検出器部には 2θ 換算で150度を超える分解能を有しております。ソフトウェアにはRAPID-AUTOが搭載されています。

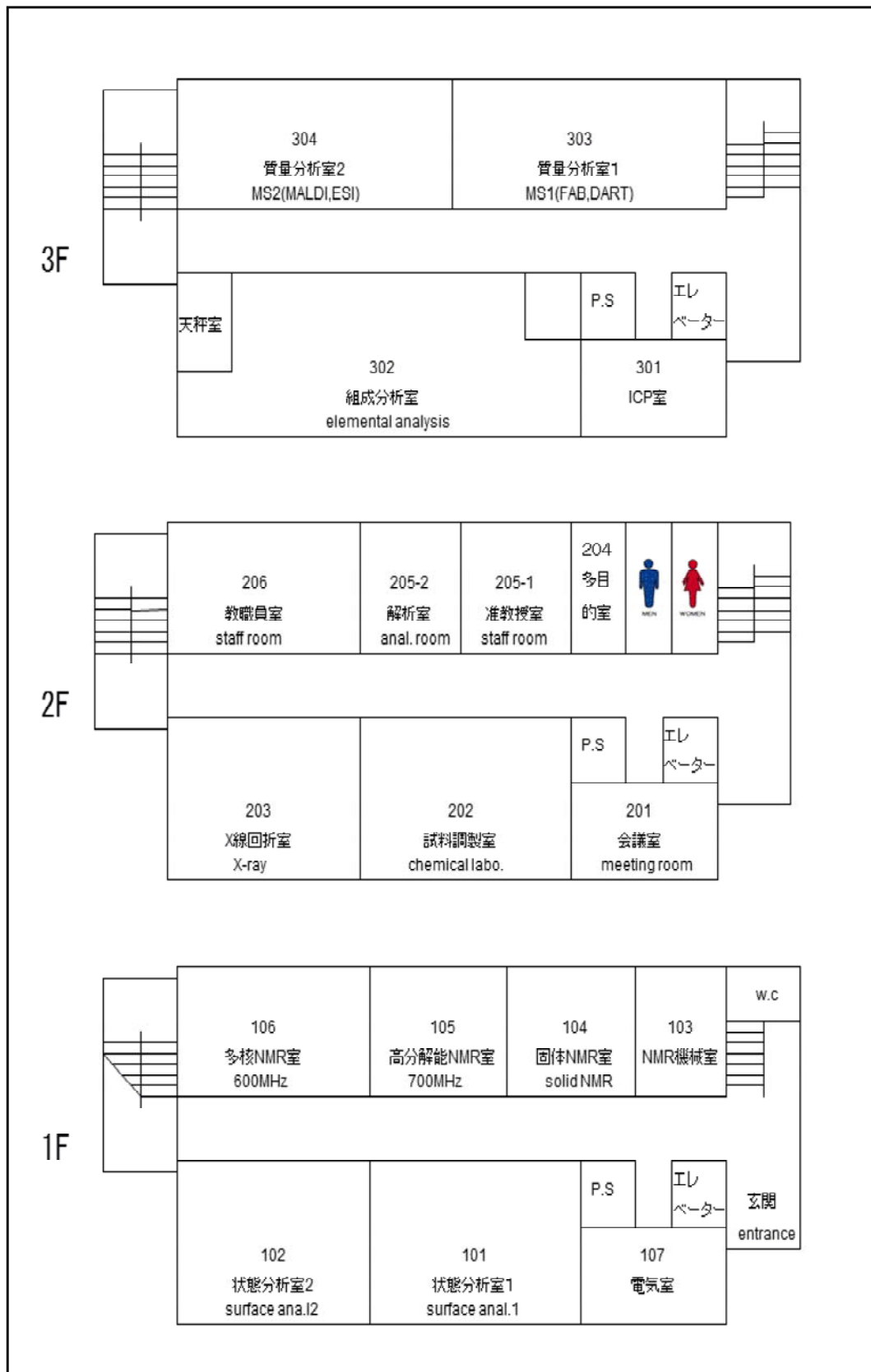
有機微量元素分析装置 CHN



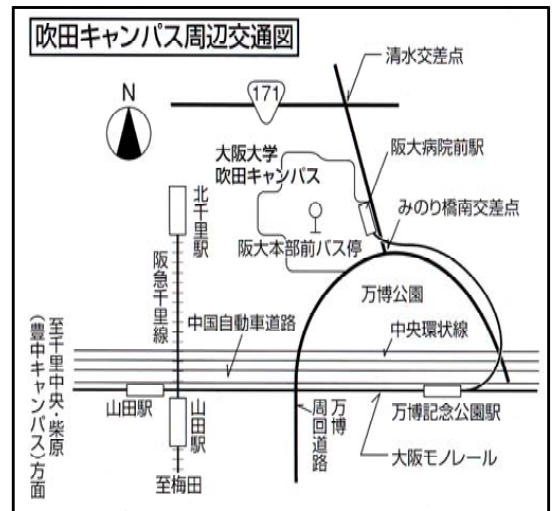
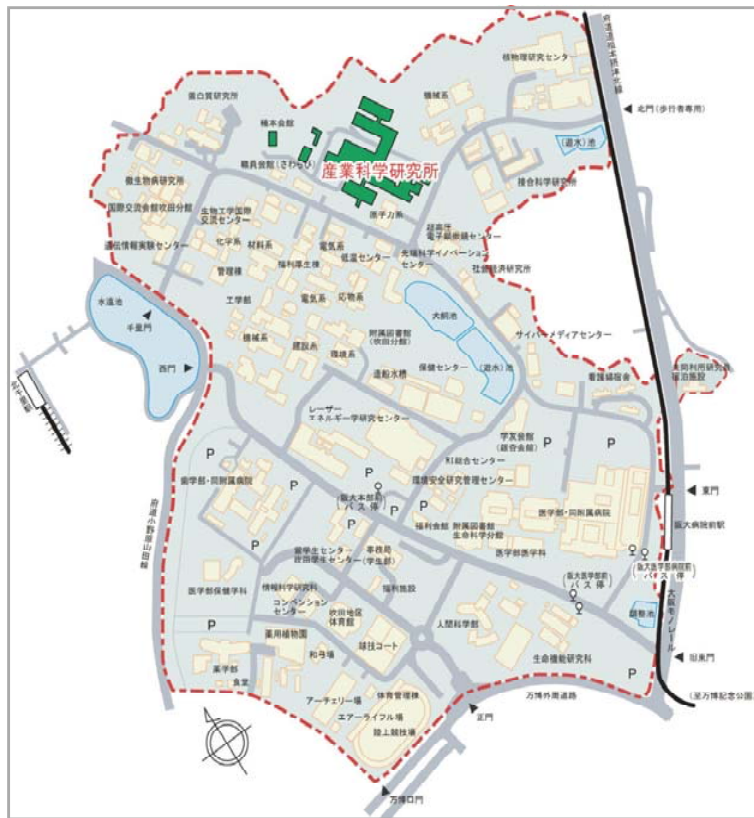
No.	IP	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H	C	N
1	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
2	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
3	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
4	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
5	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
6	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
7	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
8	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
9	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
10	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
11	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
12	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
13	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
14	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
15	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
16	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
17	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
18	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
19	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
20	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
21	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
22	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N
23	0.0	試料名	IP	試料量	炭素	水素	窒素	H <td>C <td>N</td> </td>	C <td>N</td>	N

有機化合物などの純粋な試料を燃焼酸化分解し、化合物を構成する元素の重量百分率を決定する元素分析法は、古くからの重要な定量分析法、純度検定法の一つです。主として合成化学物質の確認や天然物の化学構造の解明のために用いられる分析法で安定した物質かつ純度の高いサンプルであれば高い精度で分析値を得られます。測定元素は炭素、水素、窒素であり、同時に灰分の定量も可能です。

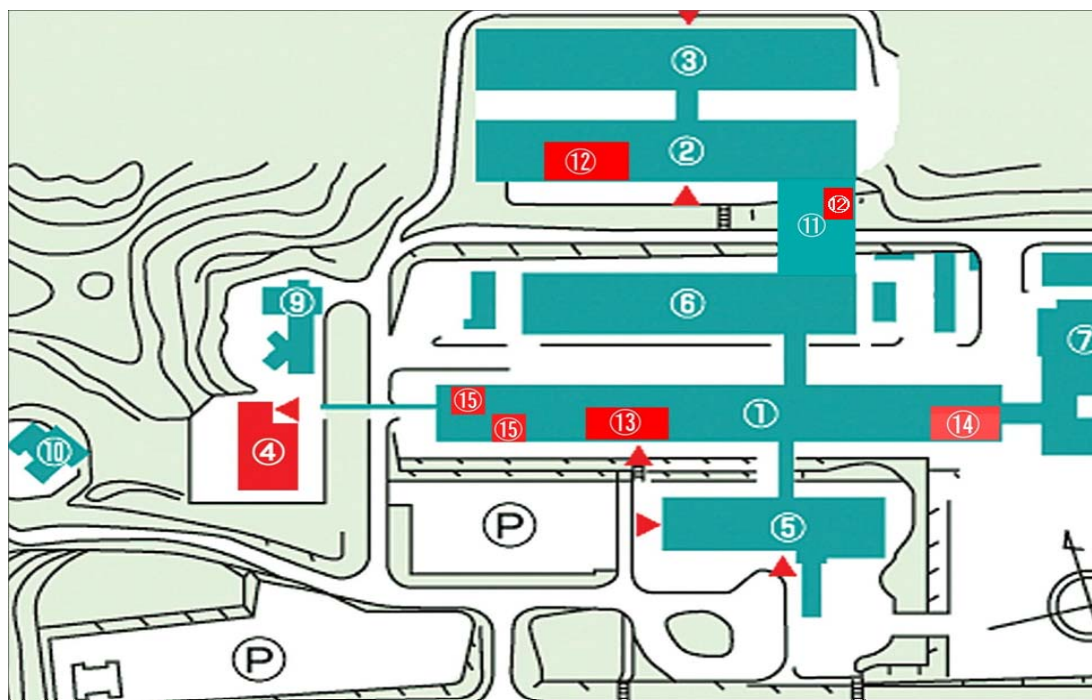
館内地図



〈地図 & 交通案内〉



- [電車] 阪急千里線 北千里駅下車 東へ徒歩 20 分
- [バス] 阪急バス 北大阪急行千里中央駅発「阪大本部前行」
近鉄バス 緩急京東線茨木市駅発「阪大本部前行」
(JR 茨木駅経由)
いずれも、阪大本部前下車 徒歩 10 分
- [モノレール] 大阪モノレール 阪大病院前駅下車 徒歩 15 分
(万博記念公園駅経由)



- ① 第 1 研究棟 ② 第 2 研究棟 ③ ナノテクノロジー総合研究棟 ④ 総合解析センター
- ⑤ 管理棟 ⑥ 工場棟 ⑦ 量子ビーム科学研究施設 (ライナック棟)
- ⑨ 産業科学ナノテクノロジーセンター電子プロセス実験室 ⑩ 楠本会館
- ⑪ インキュベーション棟 ⑫ 電界放射型高分解能電顕室 (S-102, I-103, S-105, S107 号室)
- ⑬ 化学実験室 (244, 246 号室) ⑭ 生物系電顕室 (192, 194 号室) ⑮ 核磁気共鳴室 (428, 507 号室)

■所在地 大阪大学産業科学研究所 総合解析センター
〒 567-0047 茨木市美穂ヶ丘 8-1 Tel:06-6879-8525 Fax:06-6879-8519
URL <http://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/cac/>